

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ(12) **ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ**

(21)(22) Заявка: 2012124333/28, 14.06.2012

Приоритет(ы):

(30) Конвенционный приоритет:

15.06.2011 DE 102011077567.6

(43) Дата публикации заявки: 20.12.2013 Бюл. № 35

Адрес для переписки:

197101, Санкт-Петербург, а/я 128, "АРС-

ПАТЕНТ", пат.пов. В.М. Рыбакову, рег. № 90

(71) Заявитель(и):

Пластик Лоджик Лимитед (GB),

Лейбниц-Институт Фюр Полимерфоршунг

Дрезден е.Ф. (DE)

(72) Автор(ы):

КАЛВИМОНТЕС Альфредо (DE),

ЛЕДЕРЕП Кай (DE)

(54) **СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОПОГРАФИИ ОТРАЖАЮЩИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПОКРЫТИЕМ**

(57) Формула изобретения

1. Способ определения топографии отражающих поверхностей с покрытием, при котором с помощью хроматического измерения белого света определяют трехмерную топографию покрытия и затем с помощью ультрафиолетовой интерферометрии определяют толщину покрытия и посредством сравнения с суммарными размерами покрытой поверхности определяют топографию поверхности под покрытием.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве отражающих поверхностей помещают покрытые металлом стеклянные или полимерные подложки.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве покрытий помещают нанесенные из раствора полимерные слои неотверждаемых или отверждаемых полимеров.

4. Способ по п.3, отличающийся тем, что в качестве полимерных слоев наносят эпоксиды на основе бис-фенола-А, полистирол или полиметилметакрилаты.

5. Устройство для определения топографии отражающих поверхностей с покрытием, в котором на месте измерения расположены устройство для хроматического измерения и устройство для ультрафиолетовой интерферометрии.

6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что устройство для хроматического измерения выполнено в виде хроматического датчика (CWL).

7. Устройство по п.5, отличающееся тем, что устройство для ультрафиолетовой интерферометрии выполнено в виде интерферометра ультрафиолетового - видимого спектров (UV-VIS).